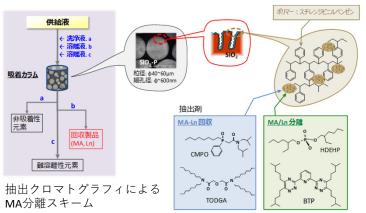
抽出クロマトグラフィ用吸着ガラスの安全性評価研究

宮﨑 康典A)、佐野 雄一A)、小藤 博英A)、渡部 創A)、江夏 昌志B)、佐藤 隆博^{C)}
A) JAEA・次世代センター、B)ビームオペレーション株式会社、^{C)} QST・高崎研

本研究の一部は、経済産業省資源エネルギー庁「平成28年度 次世代再処理ガラス固化技術基盤研究事業」の成果である。

Introduction

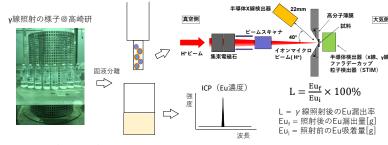
- 抽出クロマトグラフィは、現行湿式再処理プロセスに組み込むことができ、高レベル放射性廃液(HLLW)からマイナーアクチノイド(MA)を選択的に分離回収する技術として開発を進めている*1。
- 開発のモチベーション
 - 1. 多孔質シリカ粒子 (SiO₂-P) と抽出剤で構成される吸着材の利用 a. 高い空孔率および細孔径 → 速やかな拡散による分離効率向上 b. シリカ担体 → 高圧条件下でも使用可能
 - c. 金属イオンの選択性 → 含侵抽出剤の吸着性能に対応
- 2. 希釈剤が不要のため、溶媒抽出に適さない抽出剤も利用可能 3. ガラス固化体の原料となり、廃棄物量低減に貢献
- ・本研究では、MAおよび付随した核分裂生成物(FP)を吸着させた状態での保管を想定し、 α 線を模したHeイオンと γ 線の各放射線に対する CMPO吸着ガラスの金属保持能力や劣化挙動を調査した。



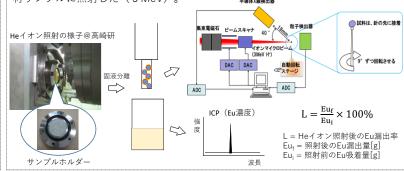
Experimental

y線照射試験

[∞]Co線源からの線量率(30 cmで約6 Gy/hr)を考慮に入れて吸着材サンプルを照射 施設内に設置し、照射線量に応じた時間で適宜取り出した。



Heイオン(模擬α線)照射試験



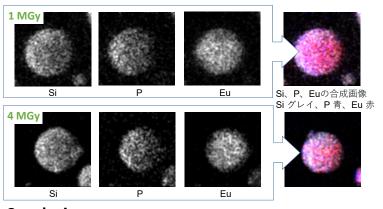
46 90

32.80

Results and Discussion

(1) 照射線量に対するCMPO吸着ガラスのEu保持能力

- 未照射の場合でもEuの漏出を確認した。これは金属錯体がCMPO単体に比べて若干の水溶性であることを示唆している。
- Heイオン(約33%):弾性散乱によってガラス粒子表面のみが劣化したため、Eu漏出率 に線量依存性が見られなかった。
- γ線(約47%): CMPOの放射線分解が2MGyで律速に達したと考えられ、Eu漏出率に しきい値が示された。
- →CMPOは放射線分解によって、P=OやC=Oのみを持つ誘導体となり *2 、金属イオンとの 錯形成に必要なキレート能力が失われるため、Euを漏出させる傾向にある。
- (2) 劣化CMPO吸着ガラスのPIXE分析 (γ線)
- 各成分の表面密度 (e.g. コントラスト) が粒子の左側に偏って見えるのは、信号強度が検出器の設置場所に依存するためであり、 実際は均一な分布と推定される。
- 照射線量によって、Euの信号強度が弱くなった(=Euの表面密度が低くなった)のは、吸着ガラスのEuがγ線によって漏出したことを示しており、上記の漏出試験の結果と一致している。



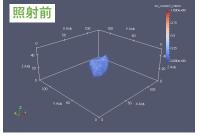
(3) 劣化CMPO吸着ガラスのEu密度分布(Heイオン)

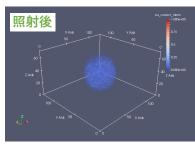
60

50

40

- 装置の空間分解能 約 1 μm
 →ガラス粒子に吸着されているEu分布の可視化には十分といえる。
- Heイオン<u>照射前</u>(左) Euがガラス粒子表面および内部に高い濃度で分布している。
- ・Heイオン<u>照射後</u>(右) ガラス粒子全体の密度分布から、Euは均一に分布しており、Heイオ ンは内部に到達していないと考えられる。
 - →吸着ガラスからは約33%程度にEuが漏出したことを考えれば、 上記の漏出試験の結果をよく反映している。





◆Heイオン線

-γ線

3 4 照射線量 (MGv)

Conclusion

- CMPO吸着ガラスはHeイオン(または α 線)や γ 線に対する放射線劣化の影響が大きく、MA等を吸着させたままの長期保管には適していない。各線量で得られる劣化生成物を調査し、結合解離パターンをまとめることで、より正確な線量依存性の評価を行う。
- PIXE分析は、吸着ガラスの金属吸着分布を評価する手法として有効である。今後は、放射線劣化の線量依存性を評価するため、定量分析を実施する。

References

*1 S. Watanabe et al., *Procedia Chem.,* **2016**, 21, 101-108. *2 Kikuchi et al*., J. Nucl. Sci. Technol.*, **2006**, 43, 562-568.